04;07;12

Исследование излучения плазмы тлеющего разряда постоянного тока на смеси He/H₂O

© А.К. Шуаибов, А.И. Дащенко, И.В. Шевера

Ужгородский национальный университет, 88000 Ужгород, Украина e-mail: ishev@univ.uzhgorod.ua

(Поступило в Редакцию 27 марта 2001 г.)

Исследованы электрические и оптические характеристики продольного тлеющего разряда постоянного тока в цилиндрической разрядной трубке на смеси гелия и насыщенных при комнатной температуре парах воды. Установлено, что основное излучение в ультрафиолетовой области длин волн представлено широкой полосой с λ_{max} =309.6 nm и $\Delta\lambda$ =9 nm. Основными диагностическими спектральными линиями исследуемой плазмы являются 656.3 nm H_{α}, 486.1 nm H_{β} и линии атома Не в области 440–670 nm. Проведена оптимизация величины яркости излучения полосы с λ_{max} =309.6 nm и интенсивности спектральных линий HeI и HI в зависимости от парциального давления гелия и величины тока тлеющего разряда. Полученные результаты представляют интерес для разработки экологически чистого излучателя на основе продуктов распада молекул и кластеров воды в плазме.

Введение

Низкотемпературная плазма на смесях инертных газов с малыми примесями паров воды является селективным источником излучения на основе продуктов распада молекул воды, которыми в большинстве случаев являются радикалы OH [1,2]. О разработке экологически чистой лампы на $\lambda = 306.4$ nm OH(A-X; 0–0) с накачкой тлеющим и высокочастотным разрядами сообщалось в работах [3]. Яркость излучения полосы OH(A-X) увеличивалась с ростом парциального давления паров воды в смесях He(Ar)/H₂O в пределах 1–130 Ра. При более высокой плотности паров воды в рабочей среде, когда возрастает роль кластерных молекул (H₂O)_n, (OH)_m и (OH)_m · (H₂O)_n в плазме, излучение разряда не исследовалось, хотя кластерная плазма может представлять определенный интерес для использования в лампах [4].

В данной работе приведены результаты исследования излучения тлеющего разряда постоянного тока в смеси гелия и паров воды при $P(H_2O) = 2.0-2.5$ kPa.

Условия эксперимента

Тлеющий разряд получали в кварцевой трубке с внутренним диаметром 7 mm и расстоянием между анодом и катодом 50 mm. Конструкция разрядной трубки была такой же, как и в нашей работе [5]. Величина мощности, вкладываемой в плазму, составляла 40–60 W, ток разряда находился в диапазоне 2–50 mA. Пары воды, насыщенные при комнатных температурах ($T = 17-21^{\circ}$ C), получали при испарении дистиллированной воды из резервуара, который устанавливался в нижней части буферной камеры. Разрядная трубка с открытыми торцевыми частями устанавливалась в верхней части буферной камеры объемом 101. Давление насыщенных паров воды находилось в пределах 2.0–2.5 kPa. Под яркостью молекулярной полосы излучения понималась площадь под кривой на спектре, который был исправлен с учетом относительной спектральной чувствительности системы регистрации излучения. Остаточное давление воздуха в буферной камере не превышало 10–15 Ра. Спектральное разрешение составляло 0.2 nm. Точность измерения яркости и интенсивности излучения плазмы составляла 7–10%.

Электрические и оптические характеристики

Тлеющий разряд постоянного тока на смеси He/H₂O при P(He) = 1-16 kPa был достаточно однороден по длине разрядной трубки. С увеличением парциального давления гелия диаметр плазменного шнура уменьшался с 4–5 до 2 mm. Нормальный режим зажигания разряда налюдался при токах $I_{ch} \ge 30$ mA, а при малых разрядных токах разряд существовал в поднормальном режиме (рис. 1). Потенциал зажигания и величина квазистационарного спада напряжения на электродах трубки в нормальном режиме зажигания разряда увеличивалась с ростом парциального давления гелия в рабочей смеси. При близких геометрических параметрах разрядной трубки и мощности $P_{ch} = I_{ch} \cdot U_{ch}$ в настоящих экспериментах величины U_{ch} и I_{ch} были соответственно на порядок выше и ниже, чем соответствующие данные из работ [3].

Спектры излучения плазмы в УФ и видимой области представлены на рис. 2. В УФ диапазоне основной в спектре излучения плазмы на смеси He/H₂O были широкая полоса с максимумом при 309.6 nm и менее яркие полосы с $\lambda_{\text{max}} = 286$ и 262 nm. Наиболее яркая полоса имела четко выраженную структуру, которая включала ряд максимумов: 307.0, 309.6 (главный), 312.4 и 315.2 nm. Наиболее близкими к полученным максимумам являются канты полос [6–8] 306.4 nm OH(A–X; 0–0)(R), 308.9 nm OH(A–X; 0–0)(Q), 312.2 nm OH(A–X; 1–1)



Рис. 1. Вольт-амперные характеристики (1, 4) и зависимости мощности (2, 3) вкладываемой в продольный тлеющий разряд от тока в смесях $P(\text{He})/P(\text{H}_2\text{O}) = 16/2.5$ (1, 2) и 1.0/2.5 kPa (3, 4).

и 318.5 nm OH(A-X; 2-2). В плазме высокочастотного разряда на парах воды при $P(H_2O) = 100 Pa$ также регистрировалась широкая полоса $\Delta \lambda = 300 - 310 \, \mathrm{nm}$ с $\lambda_{\text{max}} = 307.0, 308.3, 309.1 \text{ nm}$ (главный максимум) [9]. Излучение данной широкой полосы в [9] связывается со спонтанным распадом кластерных молекул $(H_2O)_2$, но никакого обоснования для такого отождествления не приводится. Длины волн кантов полос излучения с $\lambda_{\text{max}} = 286$ и 262 nm коррелируют с известными переходами радикалов ОН: 281.1-282.9 nm OH(A-X; 1-0), 278 nm OH(B-A) и 260.9-262.2 nm OH(A-X; 2-0). Эксперимент по исследованию излучения плазмы тлеющего разряда на смеси $He/H_2O = 0.5-16.0/2.5$ kPa в ВУФ диапазоне спектра показал, что излучение сконцентрировано в широкой полосе с $\lambda_{\text{max}} = 185 \,\text{nm}$. При уменьшении парциального давления паров воды до 0.1-0.2 kPa максимум излучения сдвигается с 185 до 180 nm, что практически совпадает с кантом полосы $\lambda_{\text{max}} = 179 \,\text{nm}$ OH(C-A) [3]. Как видно из сравнения зарегистрированных нами максимумов УФ излучения, они хорошо коррелируют с кантами наиболее ярких полос радикала ОН и немного сдвинуты в длинноволновую область спектра по сравнению с ними. Поэтому характеристическое излучение плазмы насыщенных паров воды может быть отождествлено с излучением димолей гидроксильной группы — (OH)₂. В газовой среде с повышенной плотностью паров воды происходит быстрая гидратация димолей OH в кластерные молекулы вида $(OH)_2^* \cdot (H_2O)$ (где m > 1) [10]. В плазме на основе насыщенных паров воды образование возбужденных радикалов ОН происходит в реакции:

 $e + (H_2O)_m \rightarrow H^- \cdot (H_2O)_{m-1} + OH^*.$

При столкновении радикалов ОН* и ОН в плазме становятся возможными образование димолей $(OH)_2^*$ и их последующая гидратация. В диапазоне $\Delta \lambda = 300-400$ nm наблюдались полосы 2⁺ системы

молекул азота, присутствовавших в качестве малой примеси в исследуемой газовой смеси. В видимой области спектра ($\Delta\lambda = 440-680$ nm) наблюдались спектральные линии H_{α} , H_{β} и H_{γ} , а также линии атома гелия ($\lambda = 667.8$, 587.6, 501.0, 447.1 nm). Эти спектральные линии могут использоваться при определении величин n_e , T_e методами эмиссионной спектроскопии. Интенсивность линии λ =667.8 nm He I была значительно выше, чем λ =587.6 nm He I, хотя, по данным таблиц [11], отношение их интенсивностей составляет 0.12. Верхние энергетические состояния для данных линий имеют одинаковую энергию (ε_{up} =23.07 eV [11]), а нижние значительно отличаются (соответственно ε_0 равнялось 21.22 и 20.96 eV [11]).

Увеличение интенсивности красной линии He I может быть связано с селективным расселением нижнего уровня атома гелия при столкновениях с молекулами воды или продуктами ее диссоциации в разряде.

В диапазоне P(He) = 1.0-4.0 kPa, когда разряд был достаточно однородным по радиусу разрядной трубки, яркость полосы с $\lambda_{\text{max}} = 309.6$ nm слабо спадала с ростом парциального давления гелия (рис. 3). Яркость излучения молекул примеси на $\lambda = 337.1$ nm $N_2(C-B; 0-0)$ была на порядок ниже, чем характеристической полосы 309.6 nm и имела широкий максимум при



Рис. 2. Спектры излучения плазмы на смеси $\text{He/H}_2\text{O:} a - \text{У}\Phi$ диапазон, b — видимая область.

P(He) = 8 kPa. С увеличением парциального давления гелия в смеси (когда плазменный столб переходит в контрагированное состояние) яркость полосы 309.9 nm значительно увеличивается и достигает максимума при P(He) = 8 kPa.

Типичные зависимости интенсивности излучения атомов Не и Н от величины парциального давления гелия в тлеющем разряде на смеси He/H₂O представлены на рис. 4. Интенсивность спектральной линии Н_а была примерно на порядок больше, чем линии H_{β} и характеризовалась минимумом в зависимости J = f(P(He))при давлении гелия 4 kPa. Интенсивность линии Н_в плавно уменьшалась с ростом парциального давления гелия. Максимум в зависимости J = f(P(He)) для спектральных линий 667.8; 501.0 и 491.1 nm He I достигался при парциальном давлении гелия 4-8 kPa, а для линии $\lambda = 587.6\,\mathrm{nm}$ эта зависимость была плавно нарастающей до P(He) = 16 kPa. Характер зависимости яркости полосы с $\lambda_{\text{max}} = 309.6$ nm и спектральной линии 667.8 nm He I был качественно одинаковым в диапазоне парциальных давлений гелия 4-16 kPa. Это косвенно



Рис. 3. Зависимости яркости излучения полос $\lambda_{\max} = 309.6$ (1) и 337.1 nm (2) в разряде на смеси He/H₂O от парциального давления гелия при $P(H_2O) = 2.5$ kPa и $I_{ch} = 50$ mA.



Рис. 4. Зависимости интенсивности излучения спектральных атомов гелия и водорода от величины парциального давления гелия в разряде на смеси He/H₂O = P(He)/2.5 kPa при $I_{ch} = 50$ mA: $I - \lambda = 667.8$ nm He I, $2 - \lambda = 656.3$ nm H_{α}, $3 - \lambda = 587.6$ nm He I, $4 - \lambda = 501$ nm He I, $5 - \lambda = 491.1$ nm He I, $6 - \lambda = 486.1$ nm H_{β}.



Рис. 5. Зависимость яркости излучения полос (*a*) и интенсивности спектральных линий HI и HeI (*b*) от величины тока тлеющего разряда в смеси He/H₂0 = 8.0/2.5 kPa: *a* — λ = 309.6 (*I*), 337.1 nm (*2*); *a* — λ = 667.8 HeI (*I*), 656.3 H_α (*2*), 486.1 nm H_β (*3*).

указывает на значительную роль возбужденных атомов Не при образовании возбужденных радикалов ОН и кластеров на основе (OH)* при повышенном давлении смеси He/H₂O.

Типичные зависимости характеристических полос плазмы паров воды и молекул примеси (N₂), а также интенсивности спектральных линий атомов Н и Не представлены на рис. 5. Для полосы с $\lambda_{\text{max}} = 309.6 \,\text{nm}$ зависимость яркости от I_{ch} в области малых токов была близкой к линейной, а с $I_{ch} \ge 15 - 20 \,\mathrm{mA}$ скорость роста яркости значительно увеличивалась с ростом Ich. Для полосы с $\lambda_{\text{max}} = 337.1\,\text{nm}$ данная зависимость была линейной во всем исследуемом диапазоне разрядных токов. Наиболее интенсивными спектральными линиями были $\lambda = 667$ nm He I и 656.3 nm H I, а их зависимости от величин Ich были близки к линейным. Интенсивность излучения других линий He I ($\lambda = 587.6, 506.1, 491 \, \text{nm}$) была в 10-50 раз ниже красной линии атома гелия, а характер зависимости их интенсивности от величин тока разряда были подобными.

Выводы

Исследование излучения плазмы продольного тлеющего разряда постоянного тока в смеси $\text{He/H}_2\text{O}$ при $P(\text{H}_2) = 2.5 \text{ kPa}$ показало, что в области длин

волн 200–400 nm основной является полоса с $\lambda_{\text{max}} = 309.6$ nm и шириной $\Delta \lambda = 9$ nm; диагностика параметров плазмы n_c , T_c методом эмиссионной спектроскопии может быть проведена с использованием спектральных линий 656.3 nm H_{α} , 486.1 nm H_{β} и 667.8, 587.6, 501.0, 491.1 nm He I; для получения максимальной яркости излучения полосы 309.6 nm оптимальное парциальное давления гелия составляет 8 kPa, а ее зависимости от величины тока разряда является нелинейно возрастающей в области 20–50 mA без признаков насыщения; на основе характеристической полосы с $\lambda_{\text{max}} = 309.6$ nm может быть создан простой источник УФ излучения, работающий в режиме медленной замены газовой смеси $P(\text{He})/P(\text{H}_2\text{O}) = 8.0/2.5$ kPa при $I_{ch} \geq 50$ mA.

Список литературы

- [1] Мавлютов А.А., Миськевич А.И., Саламаха Б.С. // Опт. и спектр. 1994. Т. 76. С. 946–954.
- [2] Шуаибов А.К., Шевера И.В. // ЖПС. 1997. Т. 67. С. 242-248.
- Вуль А.Я., Кидалов С.В., Миленин В.М. и др. // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. Вып. 1. С. 10–16. Там же. 1999. Т. 25. Вып. 8 С. 62–66.
- [4] Смирнов Б.М. // УФН. 2000. Т. 170. С. 495-534.
- [5] Шуаибов А.К., Дащенко А.И., Шевера И.В. // ЖПС. 2001. Т. 68. С. 275–277.
- [6] Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987.
 592 с.
- [7] Pears R.W.B., Gaydon A.G. The Identification of Molecular Spectra. London: Chapman Hall, ltd., 1963.
- [8] Wallace L. // Astrophys. J. 1962. Vol. 7. Suppl. Ser. P. 245–247.
- [9] Soskida M. // 32 EGAS. Abstact. Vilnus, 2000. P. 314-315.
- [10] Востриков А.А., Дубов Д.Ю. // ЖТФ. 1987. Т. 57. Вып. 1. С. 760–770.
- [11] Стриганов А.Р., Одинцова Г.А. // Таблицы спектральных линий атомов и ионов. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1982. 321 с.